

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 木村光宏 副委員長 馬渡宏泰
幹事 安里 彰・岡村寛之 幹事補佐 田村信幸・マラット ザニケエフ

★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 長谷川 誠 副委員長 関川純哉・久我宣裕
幹事 服部康弘・阿部宜輝 幹事補佐 上野貴博

日時 2月21日(金) 13:00~17:15

会場 パナソニック「松心会館」(門真市中町1-19. 京阪電車:門真市駅下車徒歩約5分, または大阪モノレール:門真市駅下車徒歩約5分. <http://www.shoai.jp/shoai/access.html> TEL [06] 6900-5005 一矢光雄)

議題 機構デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. リレーの信頼性解析法に関する国際標準の現況—IEC/TC94における活動経過— 青木 武(田中貴金属)
2. 放電境界領域における電気接点挙動の研究(その4)—シロキサンの酸化条件— 吉田喜郎(アルプス電気)
3. 分離アーク放電によるAg, AgSnO₂接点表面の損傷形状の3次元的比較
○長谷川 誠・河村大地(千歳科技大)
4. 真の接触面での電流集中に及ぼす自己磁界の影響
○玉井輝雄(エルコンテック)・澤田 滋・服部康弘(オートネットワーク技研)
5. 電気接点に介在するコンタクトオイルに関する研究
○小島宏治・飯田和生(三重大)・澤田 滋(オートネットワーク技研)
6. HomeBox Virtual: A New Paradigm for End-to-End Services Based on VM Visitation Platforms
Marat Zhanikeev (Kyushu Inst. of Tech.)
7. 蛍光灯照明装置における電磁雑音と信頼性評価 若井一顕(第一工大)
8. HPCF コネクタの接続損失に関する研究(2) ○飯久保忠久・中村光昭・長瀬 亮(千葉工大)
9. BOF を用いた光ファイバセンサによる圧力測定(3) ○松田健太郎・長瀬 亮(千葉工大)

◆継電器・コンタクトテクノロジー研究会, IEEE CPMT JAPAN, IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催, 日本信頼性学会協賛

☆R 研究会

【問合先】

安里 彰(富士通)

E-mail: asato@jp.fujitsu.com

☆EMD 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

3月7日(金) 横浜国大[締切済] テーマ: ショートノート(卒論・修論特集)

5月16日(金) 石巻専修大[3月5日(木)] テーマ: 一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

関川純哉(静岡大)

TEL & FAX [053] 478-1618

E-mail: tjsekik@ipc.shizuoka.ac.jp

久我宣裕(横浜国大)

TEL & FAX [045] 339-4279

E-mail: kuga@ynu.ac.jp

服部康弘(住友電装)

TEL [059] 382-8634, FAX [059] 382-8591

E-mail: yasuhiro-hattori@gate.sws.co.jp

阿部宜輝(NTT フォトニクス研究所)

TEL [046] 240-2262, FAX [046] 270-6421

E-mail: abe.yoshiteru@lab.ntt.co.jp

©EMD 研究会に関する最新の情報は, <http://www.ieice.org/es/emd/jpn/>を御参照下さい.